

各 位

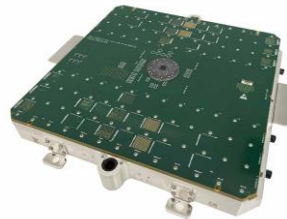
会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1-1
ニデックパークC 棟

PCIM Expo & Conference 2025 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 5 月 6 日（火）～5 月 8 日（木）にドイツニュルンベルク市で開催される「PCIM Expo & Conference 2025」に出展します。



AC/DC Capacitance tester



Probe Card



NATS-1000

本展示会はパワーエレクトロニクス業界が集結し、国境を越えて最新の開発トレンドを探り、業界全体でアイデアを共有し、ソリューションを提供していくことを目的とした展示会です

当社は今回の展示会では、パワーデバイス向けの Chip レベルからシステムレベルの最先端の検査システムを展示いたします。

また、開発期間の短縮を支援する HILS（Hardware-In-the-Loop Simulation）ボードの実演デモを行います。

当社は今後も、業界最先端の計測・検査技術で世界のモノづくりに貢献してまいります。

〈出展概要〉

- ・会 期：2025 年 5 月 6 日(火)～5 月 8 日(木)
- ・会 場：ドイツ ニュルンベルク市 NürnbergMesse
- ・ブ ース：4-432
- ・公式サイト：<https://pcim.mesago.com/events/en.html>

〈出展内容〉

- ・IGBT/SiC パワーモジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置「NATS-1000/1700 シリーズ」
- ・SiC モジュール信頼性試験装置「NATS-8000 シリーズ」
- ・モータテストベンチ用インバーター&POWER HIL モータエミュレータ「R-1100」
- ・AI を駆使した xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator®」
- ・AC/DC キャパシタンス測定用マルチテスター「R-700 シリーズ」
- ・半導体デバイス温度測定プローブ「TC-Probe」
- ・高電圧に対応した加圧構造プローブカード「Chamber head Probe Card」
- ・高温/高電流対応プローブ「3H+ Probe」